

DE10P3**30V 10A****特長**

- SMD
- 超低 $V_F=0.4V$
- 小型大電流容量

Feature

- SMD
- Ultra-Low $V_F=0.4V$
- High Io Rating・Small-PKG

用途

- バッテリー逆接防止
- DC出力OR用
- DC/DCコンバータ
- 携帯電話、パソコン

Main Use

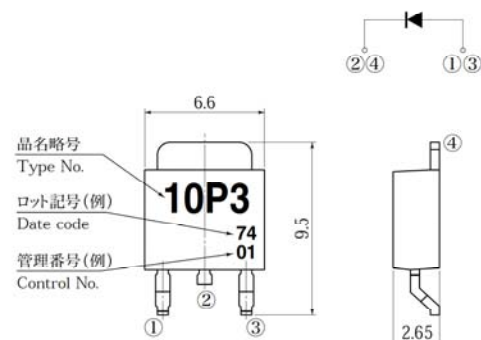
- Reverse connect protection for DC power source
- DC OR-output
- DC/DC Converter
- Mobile phone, PC

■外観図 OUTLINE

Package : E-pack

Unit:mm

Weight 0.326g (Typ)



外形図については新電元Webサイト又は〈ダイオードカタログ・技術資料編〉を参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site or the diode technical data book. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS**●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_c = 25^\circ C$)**

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	DE10P3	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T_{stg}			-55~125	$^\circ C$
接合部温度 Operation Junction Temperature	T_j			125	$^\circ C$
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V_{RM}			30	V
繰り返しせん頭サージ逆電圧 Repetitive Peak Surge Reverse Voltage	V_{RRSM}	パルス幅0.5ms, duty 1/40 Pulse width 0.5ms, duty 1/40		35	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I_o	50Hz正弦波, 抵抗負荷, $T_c = 95^\circ C$ 50Hz sine wave, Resistance load, $T_c = 95^\circ C$		10	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I_{FSM}	50Hz正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, $T_j = 25^\circ C$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, $T_j = 25^\circ C$		200	A

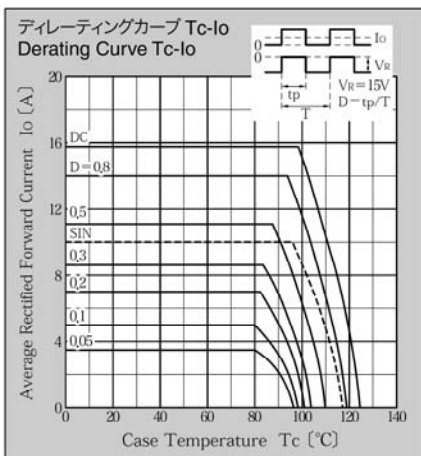
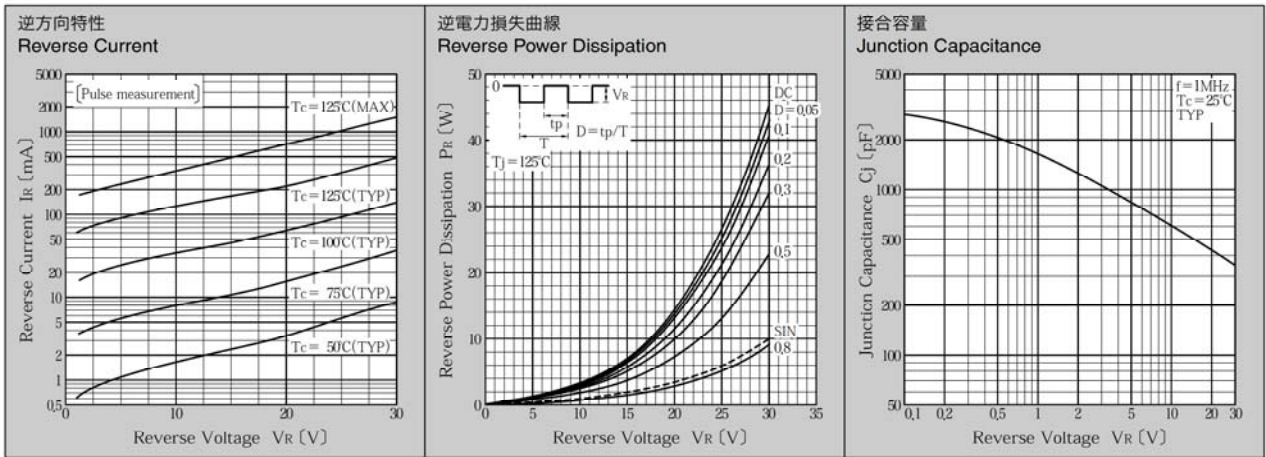
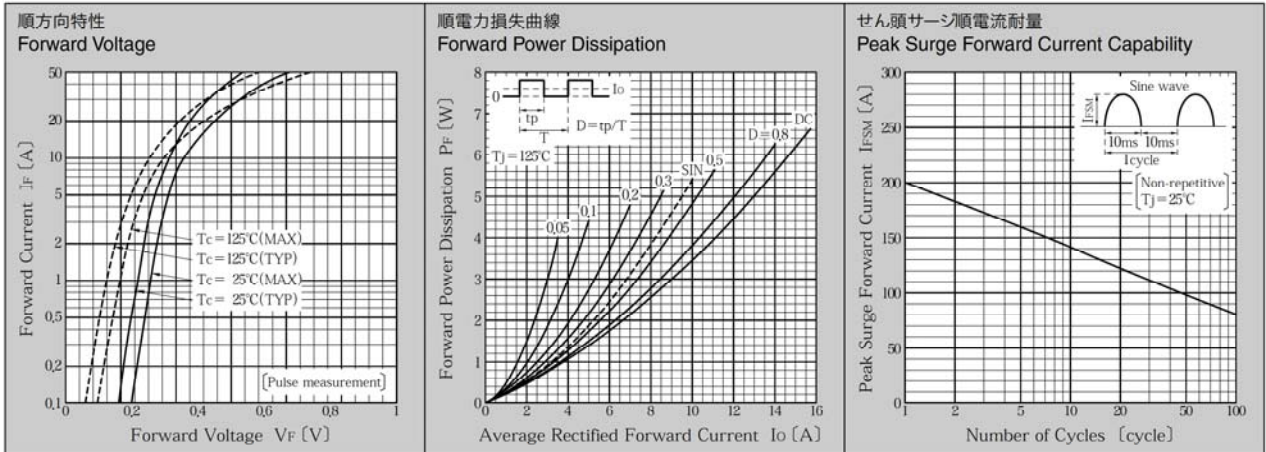
●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_c = 25^\circ C$)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	DE10P3	単位 Unit
順電圧 Forward Voltage	V_F	$I_F = 8A$, パルス測定 Pulse measurement		MAX 0.40	V
逆電流 Reverse Current	I_R	$V_R = V_{RM}$, パルス測定 Pulse measurement		MAX 25	mA
接合容量 Junction Capacitance	C_j	$f = 1MHz$, $V_R = 10V$		TYP 600	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ_{jc}	接合部・ケース間 Junction to case		MAX 4.0	$^\circ C/W$

★記載内容は製品改良のためにお断りなしに変更することがあります。

★All specifications are subject to change without notice.

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine waveは50Hzで測定しています。
* 50Hz sine wave is used for measurements.
* 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
* Typical is statistical average of the device's ability.
* Semiconductor products generally have characteristic variation.
* Typical is a statistical average of the device's ability.